

v y d á v á**OSVĚDČENÍ**

(č.j. SÚJB/OS/7957/2025)

o uznání uplatněné schválené metodiky

(v souladu s přílohou č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107)

Název metodiky:

Metodika použití zobrazovací XRF analýzy v kombinaci s APM-SIMS pro stírané vzorky jaderných materiálů

Autorský kolektiv:

RNDr. Jan Lorinčík, CSc., Mgr. Kristína Sihelská, Ing. Daniela Veselá, Ph.D., Ing. Hana Paterová, Ph.D., Ing. Ivan Elantjev, Ing. Jan Gut, Prof. doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D., Prof. doc. Tomáš Čechák, CSc., Ing. Pavel Novotný, Ph.D.

Název organizace:

Centrum výzkumu Řež s.r.o., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Místo a rok vydání metodiky:

Praha, 2025

Vypracované v rámci výzkumného projektu:

Pokročilý proces mapování rozložení uranu ve stíraných vzorcích pro zárukové účely

Číslo projektu TITSSUJB315

Název programu:

BETA 2

V Praze dne 17. 3. 2025


Ing. Michal Merxbauer, Ph.D.

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu